

エネルギー分散型 X 線分析装置



エネルギー分散型 X 線分析装置
日本電子(株)
JED-2110/JSM-5800LV 型

平成 8 年度導入 国庫補助

【主な用途・仕様】

試料表面に電子線を当てた際に発生する特性 X 線を解析することで、微小部分に含まれる元素、量および分布を調べることができます。

- ・検出可能元素 : ${}^5\text{B} \sim {}^{92}\text{U}$
- ・マッピング数 : 16 元素(最大)
- ・倍率 : 18~300,000 倍
- ・分解能 : 3.5 nm

【設備使用】

エネルギー分散型エックス線分析装置

【委託分析試験】

電子顕微鏡写真
EDS 定性分析 (固体、粉末)